

課題番号 : F-16-WS-0077  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : 半導体パラメータアナライザを用いた熱電デバイス計測  
Program Title (English) : Measurement of thermoelectric device characteristics using semiconductor parameter analyzer  
利用者名(日本語) : 橋本 修一郎  
Username (English) : S.Hashimoto  
所属名(日本語) : 早稲田大学電子物理システム学科  
Affiliation (English) : Department of Electronic and Physical Systems, Waseda University

## 1. 概要(Summary)

研究室で開発中のゼーベック効果による熱電デバイスの温度変化による電気特性計測の為、真空プローバーと半導体パラメータアナライザ(B1500A)を用いた機器のセッティングと計測を試行的に行った。

その結果、プローバー先端に温度センサを一体化させることにより、デバイス特性の計測が可能なが分かったが、プローバーの改造が必要であり、本件専属の計測装置となってしまうことが判明した。このため、別途、専用プロービングシステムを検討作製(Fig.1)し、B1500A と組み合わせる事で各種特性を計測できるようにした。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。

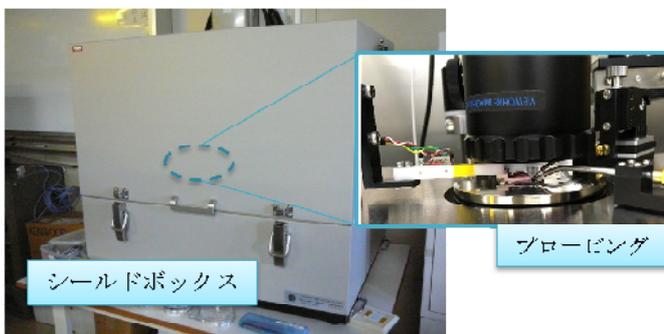


Fig.1 Photograph of Probing system.

## 2. 実験(Experimental)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。